【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和5年3月31日(2023.3.31)

【公開番号】特開2022-89374(P2022-89374A)
【公開日】令和4年6月16日(2022.6.16)
【年通号数】公開公報(特許)2022-108
【出願番号】特願2020-201721(P2020-201721)
【国際特許分類】
Ｇ０１Ｎ 23/2252(2018.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｎ 23/2252

【手続補正書】
【提出日】令和5年3月23日(2023.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
試料ステージ２は試料ステージ駆動部７により互いに直交するＸ軸、Ｙ軸の二軸方向にそれぞれ移動可能であり、この移動によって、試料３上での電子線の照射位置が２次元的に走査される。また、試料ステージ２を移動させるのではなく、電子線照射部１において電子線の射出方向を偏向させることで、試料３上での電子線の照射位置を走査することもできる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
試料３上の２次元領域内の全ての微小領域についての測定が終了し、分析者が操作部１１から所定の操作を行うと、散布図作成部９２はデータ保存部９１から所定のデータを読み出し、所定の二つの元素の強度の関係を示す２元散布図を作成する。２元散布図上の各データ点はそれぞれ試料３上の微小領域に対応する。したがって、例えば試料３上で１００００個の微小領域に対して測定が実行されれば、散布図上にプロットされるデータ点の数は１００００である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
そのあと、クラスター分析パラメーター調整部９３は、ステップＳ４、Ｓ５で求めた連続数Ｎuと連続数ＮＬとを比較し大きいほうを連続階級数Ｎと定め（ステップＳ６）、その連続階級数Ｎがその時点における距離の閾値εよりも大きいか否かを判定する（ステップＳ７）。連続階級数Ｎが距離の閾値ε以下であれば、その閾値εを修正する必要がないのでその値を維持し（ステップＳ９）、処理を終了する。一方、連続階級数Ｎが距離の閾値εよりも大きい場合には、クラスター分析パラメーター調整部９３は次の(1)式を用い

て閾値εの値を修正し（ステップＳ８）、処理を終了する。
　　ε＝（連続階級数Ｎ／全階級数Ｔ）＋補正定数Ｋ　　・・・(1)
補正定数Ｋは実験的に適宜に決められた値とすればよいが、ここでは０．００２としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　分析者が操作部１１から所定の操作を行うと、３元散布図作成部９７はデータ保存部９１から所定のデータを読み出し、指定された三つの元素の強度の関係を示す３元散布図を作成する。３元散布図上の各データ点はそれぞれ試料３上の微小領域に対応する。表示処理部９６は、作成された３元散布図を表示部１２の画面上に表示する。図８に示すように、３元散布図において放射状に延伸する線状のデータ点の集合が観測される場合、自動的なクラスター分析を行っても正確なクラスタリングが行えない可能性が高い。そこで、分析者が操作部１１で所定の操作を行うと、加算強度値データ選択処理部９８は次のようなデータ選択処理を実行する。図７は、このデータ選択処理のフローチャートである。